

497413-2026 - Konkurss

Vācija – Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles) – Dual Beam Focused Ion Beam System (FIB) und Transmissionselektronenmikroskop (TEM)

OJ S 136/2026 17/07/2026

Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms

Piegādes

1. Pircējs

1.1. Pircējs

Oficiālais nosaukums: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

E-pasts: wahl@ifos.uni-kl.de

Pircēja juridiskais statuss: Organizācija, kas piešķir līgumslēdzējas iestādes subsidētu līgumu
Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Izglītība

2. Procedūra

2.1. Procedūra

Nosaukums: Dual Beam Focused Ion Beam System (FIB) und Transmissionselektronenmikroskop (TEM)

Apraksts: Los1: DualBeam Focused Ion Beam Systems (FIB) Gegenstand ist die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Übergabe eines DualBeam Focused Ion Beam Systems (FIB) einschließlich Einweisung/Schulung und vollständiger Systemdokumentation. Die technischen Mindestanforderungen und Bewertungsaspekte ergeben sich aus den Dokumenten "Los1.25-1696.05.techn.Anforderungsprofil" und "Los1.25-1696.06.Wertungsmatrix". Los2: Transmissionselektronenmikroskop (TEM) Gegenstand ist die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Übergabe eines Transmissionselektronenmikroskops (TEM) einschließlich Einweisung/Schulung und vollständiger Systemdokumentation. Die technischen Mindestanforderungen und Bewertungsaspekte ergeben sich aus den Dokumenten "Los2.25-1707.05.techn.Anforderungsprofil" und "Los2.25-1707.06.Wertungsmatrix".

Procedūras identifikators: b3e6743d-bfc2-4cac-a001-90b28790bddd

Iekšējais identifikators: 25-1696-1707

Procedūras veids: Atklāta

Procedūra ir paātrināta: nē

Procedūras galvenās iezīmes: Die Vergabe erfolgt in zwei Losen (Los 1: FIB, Los 2: TEM). Bieter, die Angebote für beide Lose abgeben, können zusätzlich ein Gesamtangebot (Kombinationsangebot) einreichen. Das Kombinationsangebot muss auf den angebotenen Einzel-Angeboten zu beiden Losen basieren; der Leistungsumfang des Kombinationsangebotes muss den Leistungsumfängen der Angebote auf die Einzellöse entsprechen. Das Kombinationsangebot ist zusätzlich zu den losweisen Angeboten einzureichen und muss: - einen gesonderten Gesamtpreis für beide Lose (unter Berücksichtigung etwaiger Preisvorteile, z. B. Rabatte), sowie - eine Darstellung eines etwaigen losübergreifenden wissenschaftlichen, technischen, funktionalen oder organisatorischen Mehrwerts einer gemeinsamen Präparations- und Analytikplattform enthalten. Etwaige Preisvorteile werden ausschließlich im Zuschlagskriterium "Preis" berücksichtigt. Ein losübergreifender Mehrwert wird ausschließlich im Zuschlagskriterium "Technik" bewertet und setzt voraus, dass dieser über die Bewertung der Einzellöse

hinausgeht und sich aus dem Zusammenwirken beider Systeme ergibt. Die Bewertung der Kombinationsangebote erfolgt nach denselben Zuschlagskriterien. Zusätzlich werden losübergreifende Aspekte wie die vollständige wissenschaftliche Prozesskette einer Probe - von der Präparation im FIB über den qualitätserhaltenden Proben transfer und die korrelative Untersuchung im TEM bis hin zum gemeinsamen Datenmanagement und der nachvollziehbaren Dokumentation der Untersuchungsergebnisse berücksichtigt. Der Auftraggeber behält sich vor, den Zuschlag entweder losweise oder losübergreifend zu erteilen.

2.1.1. Mērķis

Līguma veids: Piegādes

Galvenā klasifikācija (cpv): 38000000 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)

2.1.2. Izpildes vieta

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)

Valsts: Vācija

2.1.4. Vispārīga informācija

Papildu informācija: #Bekanntmachungs-ID: CXP4DNMMUBY#

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

vgv -

2.1.5. Iepirkuma noteikumi

Iesniegšanas noteikumi:

Maksimālais daļu skaits, par kuru pretendents var iesniegt piedāvājumus: 2

Līguma noteikumi:

Maksimālais daļu skaits, par kuru var piešķirt līgumus vienam pretendētājam: 2

2.1.6. Izslēgšanas iemesli

Izslēgšanas iemeslu avoti: Paziņojums

Valsts tiesību aktos noteikto pienākumu neizpilde, kas izraisa izslēgšanu:

Dalība noziedzīgā organizācijā:

Teroristu nodarījumi vai nodarījumi, kas saistīti ar teroristu darbībām:

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai teroristu finansēšana:

Krāpšana:

Korupcija:

Bērnu darbs un citi cilvēku tirdzniecības veidi:

Nodokļu maksāšanas pienākuma pārkāpums:

Sociālā nodrošinājuma iemaksu maksāšanas pienākuma pārkāpums:

Pienākumu neizpilde vides tiesību jomā:

Pienākumu neizpilde sociālo tiesību jomā:

Pienākumu neizpilde darba tiesību jomā:

Maksātnespēja:

Aktīvi, kurus pārvalda likvidators:

Uzņēmējdarbību aptur:

Līdzīga situācija kā bankrots saskaņā ar valsts tiesību aktiem:

Smags pārkāpums saistībā ar profesionālo rīcību:

Nolīgumi ar citiem ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir izkropļot konkurenci:

Interesu konflikts saistībā ar tās dalību iepirkuma procedūrā:

Tieša vai netieša iesaistīšanās šīs iepirkuma procedūras sagatavošanā;

Pirmstermiņa izbeigšana, zaudējumu atlīdzināšana vai citas līdzīgas sankcijas:
Nepatiesas informācijas sniegšana, informācijas noklusēšana, nespēja sniegt pieprasītos dokumentus vai iegūta konfidenciāla informācija šajā procedūrā:

5. Daļa

5.1. Daļa: LOT-0001

Nosaukums: Dual Beam Focused Ion Beam System (FIB)

Apraksts: Ziel dieses Beschaffungsvorhabens ist die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Übergabe eines Dual-Beam-FIB/REM-Systems (Focused Ion Beam / Rasterelektronenmikroskop) einschließlich analytischer Detektorsysteme, Schulung und vollständiger Systemdokumentation. Das System dient primär der präzisen Probenpräparation (u.a. TEM-Lamellen, APT-Spitzen, Querschnitte und Defektfreilegungen) und sekundär der hochauflösenden bildgebenden, chemischen und strukturellen Charakterisierung (SEM, EDX, STEM, EBSD) im selben System. Das Gerät wird als zentrale Präparations- und Analyseplattform für wissenschaftliche Forschungsprojekte eingesetzt. Typische Anwendungen umfassen u. a. Batterie- und Elektrodenmaterialien, Wasserstoffspeichermaterialien, katalytische Schichten, Metalle/Legierungen, keramische Werkstoffe, Halbleiter, Beschichtungen und Multilayer-Systeme. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf: - reproduzierbarer, möglichst automatisierter TEM-Lamellen- und APT-Präparation (Lift-Out, Thinning, Polishing) - 3D-Analytik (Serienschliff/Tomographie) mit quantitativer Auswertung - hochaufgelöster Abbildung in verschiedenen SEM-Modi incl. Ioneninduzierter Sekundärionen sowie korrelierter Bildgebung während der Bearbeitung - chemischer Analytik mittels EDX und kristallographischer Analytik mittels EBSD Darüber hinaus ist eine strukturierte Erfassung und Exportfähigkeit von Messdaten und Metadaten in gängige, nicht-proprietäre Formate erforderlich, um Anforderungen an Nachvollziehbarkeit, Langzeitverfügbarkeit und Forschungsdatenmanagement (FAIR-Prinzipien) zu erfüllen. Das System muss die präzise Probenpräparation und -strukturierung mittels Ionenstrahl sowie die begleitende und nachfolgende Abbildung und Analytik mittels SEM und anderen Detektorsystemen ermöglichen. Ziel ist die reproduzierbare Präparation von Proben für TEM und APT sowie die Durchführung von 2D/3D-Analysen (Bildgebung (SE, STEM), EDX, EBSD) einschließlich vollständiger Dokumentation der Bearbeitungs- und Messparameter. Folgende Kernfunktionen sind zwingend bereitzustellen: 1. Materialabtrag/Strukturierung (manuell und automatisiert) mit definierbaren Pattern- und Rezeptfunktionen. 2. TEM-Lamellenpräparation inkl. In-situ Lift-Out, Thinning und abschließender Feinpolitur. 3. APT-Spitzenpräparation (Needle Milling) inkl. reproduzierbarer Geometrie. 4. Korrelierte Echtzeit-Bildgebung im SEM während der FIB-Bearbeitung (Navigation/Endpunktkontrolle). 5. Chemische Analytik mittels EDX sowie kristallographische Analytik mittels EBSD (Punkt, Linie, Mapping). 6. 3D-Workflows (Serienschliff/Tomographie) mit dokumentierter Rekonstruktion bzw. Export der Datensätze. 7. Workflow und Datenmanagement: eindeutige Zuordnung von Bearbeitungs-/Messdaten, Parametern und Metadaten; Export in nicht proprietäre Formate.

lekšējais identifikators: 1

5.1.1. Mērķis

Līguma veids: Piegādes

Galvenā klasifikācija (cpv): 38000000 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)

5.1.2. Izpildes vieta

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)

Valsts: Vācija

5.1.3. Paredzamais ilgums

Ilgums – cits: Nezināms

5.1.6. Vispārīga informācija

Rezervēta dalība:

Dalība nav rezervēta.

Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: Netiek prasīts iepirkuma projekts, ko pilnībā vai daļēji finansē no ES fondiem

Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: nē

Šis iepirkums ir piemērots arī maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU): nē

5.1.7. Stratēģiskais iepirkums

Stratēģiskā iepirkuma mērķis: Nav stratēģiskā iepirkuma

5.1.9. Atlases kritēriji

Atlases kritēriju avoti: Paziņojums

Kritērijs: Atsauksmes par noteiktām piegādēm

Atlases kritērija apraksts: Eignungskriterium ist die Vorlage von 3 Referenzen zu vergleichbaren Installationen. Bei Angeboten für ein Los sind Referenzen für vergleichbare Systeme des jeweiligen Loses vorzulegen. Bei Angeboten für beide Lose können Referenzen für beide Systemtypen oder vergleichbare integrierte Systeme eingereicht werden. Als vergleichbare Referenzen gelten erfolgreich durchgeführte Liefer-, Installations- und Inbetriebnahmeprojekte von Systemen, die in Art, Funktion und Komplexität dem jeweils angebotenen Los entsprechen (Los 1: DualBeam FIB bzw. vergleichbare FIB/SEM-Systeme; Los 2: TEM bzw. vergleichbare Elektronenmikroskope). Die Referenzen müssen den vollständigen Leistungsumfang (Lieferung, Installation, Inbetriebnahme, betriebsbereite Übergabe sowie Einweisung) umfassen und in einem wissenschaftlichen oder industriellen High-Tech-Umfeld erbracht worden sein. Sie dürfen zum Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist nicht älter als drei Jahre sein.

5.1.10. Piešķiršanas kritēriji

Kritērijs:

Veids: Cena

Nosaukums: Preis (Angebote auf Einzellose und Kombinationsangebote)

Apraksts: Für das Zuschlagskriterium Preis erhält das Angebot mit dem niedrigsten (gewerteten) Preis 5 Punkte. Null Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem Doppelten des niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises. Alle Angebote mit einem Angebotspreis über dem Doppelten des niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises erhalten ebenfalls null Punkte. Die Punktebewertung für die dazwischenliegenden Angebotspreise erfolgt über eine lineare Interpunktion mit 4 Stellen hinter dem Komma.

Kategorija piešķiršanas kritērija svārs: Svērums (precīza procentuālā attiecība)

Piešķiršanas kritērija skaitlis: 50

Kritērijs:

Veids: Kvalitāte

Nosaukums: Technik (Angebote auf Einzellose bzw. Kombinationsangebote)

Apraksts: Für das Zuschlagskriterium Technik werden ausschließlich die nachgewiesenen technischen Leistungsparameter von im Dokument 06. Wertungsmatrix Abschnitt 2 (technische Übererfüllung (wertungsrelevant)) des jeweiligen Loses genannten Anforderungen bewertet. Das Zuschlagskriterium Technik wird ermittelt, indem die Wertungspunkte der einzelnen Anforderungen jeweils mit dem festgelegten Gewichtungsfaktor gemäß Dokument "06.

Wertungsmatrix", Abschnitt 2 ("technische Übererfüllung (wertungsrelevant)") des jeweiligen Loses, multipliziert und anschließend aufsummiert werden. Die technische Bewertung eines Kombinationsangebotes setzt sich aus der technischen Bewertung der beiden Einzellose sowie der Bewertung des zusätzlichen wissenschaftlichen und funktionalen Mehrwerts der gemeinsamen Präparations- und Analytikplattform zusammen. Unterkriterien für diesen Mehrwert sind: K1 durchgängiger Probenworkflow zwischen FIB und TEM K2 Qualität des Probentransfers K3 korrelative Wiederauffindbarkeit identischer Probenbereiche K4 gemeinsames Daten- und Projektmanagement K5 gemeinsames Service- und Betriebskonzept Ergänzend wird auf das Dokument "Gesamt.06.Wertungsmatrix.pdf." Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīza procentuālā attiecība) Piešķiršanas kritērija skaitlis: 50

5.1.11. Iepirkuma dokumenti

Valodas, kurās ir oficiāli pieejami iepirkuma dokumenti: vācu valoda
Termiņš papildu informācijas pieprasīšanai: 10/08/2026 23:59:59 (UTC+02:00)
Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY/documents>

Ad hoc saziņas kanāls:

URL: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY>

5.1.12. Iepirkuma noteikumi

Iesniegšanas noteikumi:

Elektroniskā iesniegšana: Prasīts

Iesniegšanas adrese: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY>

Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: vācu valoda

Elektroniskais katalogs: Nav atļauts

Varianti: Nav atļauts

Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Atļauts

Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 17/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks

Laiks, kurā piedāvājumam jā saglabājas derīgam: 77 Dienas

Informācija, ko var papildināt pēc iesniegšanas termiņa beigām:

Pircējs pēc saviem ieskatiem visus ar pretendentu saistītos trūkstošos dokumentus var iesniegt vēlāk.

Papildu informācija: Die Vergabestelle behält sich vor, fehlende Angaben und Erklärungen nachzufordern. Ein Anspruch der Bieter besteht nicht (§ 56 VgV). Angebote, die nicht die geforderten oder gegebenenfalls nachgeforderten Erklärungen und Nachweise enthalten, werden nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 VgV ausgeschlossen.

Līguma noteikumi:

Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē

Elektroniskie rēķini: Atļauts

Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē

Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15. Paņēmieni

Pamat nolīgums:

Nav pamat nolīguma

Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu:

Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16. Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana

Pārskatīšanas organizācija: Vergabekammer Rheinland-Pfalz, c/o Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima

Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Die Vergabekammer leitet ein

Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. Der Antrag ist unzulässig, soweit - der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen

Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt.

Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

5.1. Daļa: LOT-0002

Nosaukums: Transmissionselektronenmikroskop (TEM)

Apraksts: Gegenstand des Beschaffungsvorhabens ist die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Übergabe eines aberrationskorrigierten 200 kV Transmissionselektronenmikroskops (S/TEM) einschließlich analytischer Detektorsysteme, Schulung und vollständiger Systemdokumentation. Das System dient als zentrale Analyseplattform für die hochauflösende strukturelle, chemische und elektronische Charakterisierung von Materialien auf atomarer und nanometergenauer Skala. Es wird sowohl für industrielle Auftragsanalytik als auch für wissenschaftliche Forschungsprojekte eingesetzt. Im Institut werden Materialien mit stark variierenden Eigenschaften untersucht, insbesondere Metalle, Legierungen, keramische Werkstoffe, Halbleiter, Beschichtungen, funktionale Schichtsysteme sowie nanostrukturierte Materialien. Die Proben unterscheiden sich hinsichtlich Geometrie, Stabilität gegenüber Elektronenstrahlbelastung sowie analytischer Fragestellungen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf: - hochauflösender Abbildung bis in den atomaren Bereich - chemischer Analytik mittels EDX und EELS - Untersuchung von Grenzflächen und Defekten - Untersuchung magnetischer und funktionaler Materialien - reproduzierbaren Messungen über Probenserien hinweg Darüber hinaus ist eine strukturierte Erfassung und Exportfähigkeit von Messdaten und Metadaten in gängige, nicht-proprietäre Formate erforderlich, um Anforderungen an Nachvollziehbarkeit, Langzeitverfügbarkeit und Forschungsdatenmanagement (FAIR-Prinzipien) zu erfüllen. Das System muss die hochauflösende strukturelle, chemische und elektronische Analyse von festen, elektronenstrahlstabilen Proben im Transmissionselektronenmikroskopie- und Raster-Transmissionselektronenmikroskopie-Modus ermöglichen. Hierzu muss es eine präzise Elektronenoptik, stabile Betriebsbedingungen sowie integrierte analytische Detektionssysteme

bereitstellen. Ziel ist die Untersuchung von Materialien bis in den atomaren Maßstab sowie die quantitative und qualitative Analyse von Struktur, Zusammensetzung und elektronischen Eigenschaften. Folgende Kernfunktionen sind zwingend bereitzustellen: 1. Hochauflösende Abbildung (TEM und STEM): - Abbildung von Kristallstrukturen, Defekten, Grenzflächen und Nanostrukturen mit atomarer bzw. sub-nanometergenauer Auflösung. - Betrieb sowohl im konventionellen TEM- als auch im STEM-Modus. - Flexible Wahl geeigneter Abbildungsmodi (z. B. Bright Field, Dark Field, HAADF, ABF, Oberflächenbildgebung mit topografieabhängigem Kontrast). 2. Chemische und spektroskopische Analytik: - Elementanalytik mittels energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDX). - Analyse elektronischer und chemischer Zustände mittels Elektronenenergieverlustspektroskopie (EELS). - Durchführung von Punktanalysen, Linienprofilen sowie zweidimensionalem Mapping. 3. Untersuchung von Grenzflächen und Defekten: - Analyse von Phasengrenzen, Ausscheidungen, Korngrenzen und strukturellen Inhomogenitäten. - Untersuchung lokaler chemischer Variationen auf nanoskaliger Ebene. 4. Untersuchung funktionaler und magnetischer Materialien: - Möglichkeit zur magnetfeldfreien oder feldarmen Abbildung (z. B. Lorentz-Modus oder funktional gleichwertig), soweit erforderlich. 5. Automatisierter und reproduzierbarer Betrieb: - Reproduzierbare Einstellung von Messparametern und Speicherung von Messabläufen. - Unterstützung automatisierter Messreihen und Mapping-Experimente. 6. Workflow und Datenmanagement: - Eindeutige Zuordnung von Messdaten, Parametern und Metadaten. - Möglichkeit zur späteren Reproduktion von Messbedingungen. 7. Integration aller Detektoren und Betriebsmodi in eine konsistente Bedienumgebung.

lekšējais identifikators: 2

5.1.1. Mērķis

Līguma veids: Piegādes

Galvenā klasifikācija (cpv): 38000000 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)

5.1.2. Izpildes vieta

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)

Valsts: Vācija

5.1.3. Paredzamais ilgums

Ilgums – cits: Nezināms

5.1.6. Vispārīga informācija

Rezervēta dalība:

Dalība nav rezervēta.

Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: Netiek prasīts iepirkuma projekts, ko pilnībā vai daļēji finansē no ES fondiem

Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: nē

Šis iepirkums ir piemērots arī maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU): nē

5.1.7. Stratēģiskais iepirkums

Stratēģiskā iepirkuma mērķis: Nav stratēģiskā iepirkuma

5.1.9. Atlases kritēriji

Atlases kritēriju avoti: Paziņojums

Kritērijs: Atsauksmes par noteiktām piegādēm

Atlases kritērija apraksts: Eignungskriterium ist die Vorlage von 3 Referenzen zu vergleichbaren Installationen. Bei Angeboten für ein Los sind Referenzen für vergleichbare Systeme des jeweiligen Loses vorzulegen. Bei Angeboten für beide Lose können Referenzen

für beide Systemtypen oder vergleichbare integrierte Systeme eingereicht werden. Als vergleichbare Referenzen gelten erfolgreich durchgeführte Liefer-, Installations- und Inbetriebnahmeprojekte von Systemen, die in Art, Funktion und Komplexität dem jeweils angebotenen Los entsprechen (Los 1: DualBeam FIB bzw. vergleichbare FIB/SEM-Systeme; Los 2: TEM bzw. vergleichbare Elektronenmikroskope). Die Referenzen müssen den vollständigen Leistungsumfang (Lieferung, Installation, Inbetriebnahme, betriebsbereite Übergabe sowie Einweisung) umfassen und in einem wissenschaftlichen oder industriellen High-Tech-Umfeld erbracht worden sein. Sie dürfen zum Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist nicht älter als drei Jahre sein.

5.1.10. Piešķiršanas kritēriji

Kritērijs:

Veids: Cena

Nosaukums: Preis (Angebote auf Einzellöse und Kombinationsangebote)

Apraksts: Für das Zuschlagskriterium Preis erhält das Angebot mit dem niedrigsten (gewerteten) Preis 5 Punkte. Null Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem Doppelten des niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises. Alle Angebote mit einem Angebotspreis über dem Doppelten des niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises erhalten ebenfalls null Punkte. Die Punktebewertung für die dazwischenliegenden Angebotspreise erfolgt über eine lineare Interpunktion mit 4 Stellen hinter dem Komma.

Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīza procentuālā attiecība)

Piešķiršanas kritērija skaitlis: 50

Kritērijs:

Veids: Kvalitāte

Nosaukums: Technik (Angebote auf Einzellöse bzw. Kombinationsangebote)

Apraksts: Für das Zuschlagskriterium Technik werden ausschließlich die nachgewiesenen technischen Leistungsparameter von im Dokument 06.Wertungsmatrix Abschnitt 2 (technische Übererfüllung (wertungsrelevant)) des jeweiligen Loses genannten Anforderungen bewertet. Das Zuschlagskriterium Technik wird ermittelt, indem die Wertungspunkte der einzelnen Anforderungen jeweils mit dem festgelegten Gewichtungsfaktor gemäß Dokument "06. Wertungsmatrix", Abschnitt 2 ("technische Übererfüllung (wertungsrelevant)") des jeweiligen Loses, multipliziert und anschließend aufsummiert werden. Die technische Bewertung eines Kombinationsangebotes setzt sich aus der technischen Bewertung der beiden Einzellöse sowie der Bewertung des zusätzlichen wissenschaftlichen und funktionalen Mehrwerts der gemeinsamen Präparations- und Analytikplattform zusammen. Unterkriterien für diesen Mehrwert sind: K1 durchgängiger Probenworkflow zwischen FIB und TEM K2 Qualität des Probentransfers K3 korrelative Wiederauffindbarkeit identischer Probenbereiche K4 gemeinsames Daten- und Projektmanagement K5 gemeinsames Service- und Betriebskonzept Ergänzend wird auf das Dokument "Gesamt.06.Wertungsmatrix.pdf."

Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīza procentuālā attiecība)

Piešķiršanas kritērija skaitlis: 50

5.1.11. Iepirkuma dokumenti

Valodas, kurās ir oficiāli pieejami iepirkuma dokumenti: vācu valoda

Terminš papildu informācijas pieprasīšanai: 10/08/2026 23:59:59 (UTC+02:00)

Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks

Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY/documents>

Ad hoc saziņas kanāls:

URL: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY>

5.1.12. Iepirkuma noteikumi

Iesniegšanas noteikumi:

Elektroniskā iesniegšana: Prasīts

Iesniegšanas adrese: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY>

Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: vācu valoda

Elektroniskais katalogs: Nav atļauts

Varianti: Nav atļauts

Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Atļauts

Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 17/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks

Laiks, kurā piedāvājumam jā saglabājas derīgam: 77 Dienas

Informācija, ko var papildināt pēc iesniegšanas termiņa beigām:

Pircējs pēc saviem ieskatiem visus ar pretendentu saistītos trūkstošos dokumentus var iesniegt vēlāk.

Papildu informācija: Die Vergabestelle behält sich vor, fehlende Angaben und Erklärungen nachzufordern. Ein Anspruch der Bieter besteht nicht (§ 56 VgV). Angebote, die nicht die geforderten oder gegebenenfalls nachgeforderten Erklärungen und Nachweise enthalten, werden nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 VgV ausgeschlossen.

Līguma noteikumi:

Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē

Elektroniskie rēķini: Atļauts

Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē

Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15. Paņēmieni

Pamat nolīgums:

Nav pamat nolīguma

Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu:

Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16. Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana

Pārskatīšanas organizācija: Vergabekammer Rheinland-Pfalz, c/o Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima

Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Die Vergabekammer leitet ein

Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. Der Antrag ist unzulässig, soweit - der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu

wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt.
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH
Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

8. Organizācijas

8.1. ORG-0001

Oficiālais nosaukums: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH
Reģistrācijas numurs: UStID DE148647541
Pasta adrese: Trippstadter Straße 120
Pilsēta: Kaiserslautern
Pasta indekss: 67663
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)
Valsts: Vācija
E-pasts: wahl@ifos.uni-kl.de
Tālrunis: +49 631205730
Šīs organizācijas lomas:
Pircējs
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru
Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus

8.1. ORG-0002

Oficiālais nosaukums: eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft rechtsanwaltsgesellschaft
Reģistrācijas numurs: UStID DE267215971
Pasta adrese: Kramergasse 4
Pilsēta: Dresden
Pasta indekss: 01067
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)
Valsts: Vācija
E-pasts: l.moerchen@eureos.de
Tālrunis: +49 39156286912
Šīs organizācijas lomas:
Iepirkuma pakalpojumu sniedzējs

8.1. ORG-0003

Oficiālais nosaukums: Vergabekammer Rheinland-Pfalz, c/o Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima
Reģistrācijas numurs: 07-0001801100000-05
Pasta adrese: Stiftsstraße 9
Pilsēta: Mainz
Pasta indekss: 55116
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Mainz, Kreisfreie Stadt (DEB35)
Valsts: Vācija
E-pasts: vergabekammer.rlp@mwwlw.rlp.de
Tālrunis: +49 6131162234
Šīs organizācijas lomas:
Pārskatīšanas organizācija

8.1. ORG-0004

Oficiālais nosaukums: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Reģistrācijas numurs: 0204:994-DOEVD-83

Pilsēta: Bonn

Pasta indekss: 53119

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Valsts: Vācija

E-pasts: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Tālrunis: +49228996100

Šīs organizācijas lomas:

TED eSender

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: c6abad07-e17d-4e42-b1fc-35d01bf3fcf6 - 01

Veidlapas tips: Konkurss

Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms

Paziņojuma apakšveids: 16

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 15/07/2026 17:22:32 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks

Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: vācu valoda

Paziņojuma publikācijas numurs: 497413-2026

OV S sērijas izdevuma numurs: 136/2026

Publicēšanas datums: 17/07/2026